# 2023春半导体物理习题课 第三章 电磁场中的输运现象

宋冰睿 王民泽

2023.5.10

1/32

- 1 题4.2
- ② 题4.3
- ③ 题4.7
- 4 题4.11
- 5 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ③ 补充题



## 本征Si和掺杂Si的电导率

#### 对于本征Si:

- ① 试计算其在室温时的电导率. 设电子和空穴迁移率分别 为 $1450 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ 和 $500 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ;
- ② 当掺入百万分之一的As后,设杂质全部电离,试计算其电导率及相对本征Si增大的倍数.

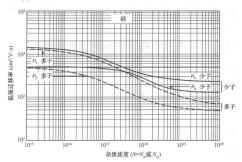


图: P107图4-14(a)



# 本征Si和掺杂Si的电导率(1)(2)

查P66表3-2知本征Si在室温时的 $n_i = 1.02 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ,因此电导率

$$\sigma_i = n_i e \left( \mu_n + \mu_p \right) \approx 3.182 \times 10^{-6} \text{S/cm}$$
 (1.1)

查P378表B-1知Si的晶格常数a=0.543nm, 得到Si的原子密度

$$n(Si) = \frac{8}{a^3} \approx 5 \times 10^{28} \text{m}^{-3}$$
 (1.2)

因此掺杂后,杂质全部电离产生的载流子浓度

$$n = 5 \times 10^{16} \text{cm}^{-3} \gg n_i \tag{1.3}$$

可忽略本征激发. 查P107图4-14(a)知 $\mu_n \approx 800 \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$ ,可得电导率

$$\sigma = ne\mu_n = 6.4 \text{S/cm} \tag{1.4}$$

二者之比

$$\frac{\sigma}{\sigma_i} \approx 2.011 \times 10^6 \tag{1.5}$$

- 1 题4.2
- 2 题4.3
- ③ 题4.7
- 4 题4.11
- 5 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ③ 补充题



## 掺杂Si的载流子浓度

试估算电阻率为 $10\Omega \cdot m$ 的p-type Si样品在室温时的多子及少子浓度.

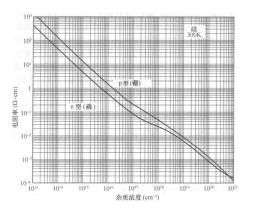


图: P109图4-15(b)

## 掺杂Si的载流子浓度

查P109图4-15(b)知,  $10^3\Omega \cdot \text{cm}$ 电阻率对应的受主B浓度 $N_A \approx 1.5 \times 10^{13} \text{cm}^{-3} > 10n_i$ .

下面计算室温下杂质全部电离的浓度上限. 查P43图2-8知B的电离能 $\Delta E_A=0.044 \mathrm{eV}$ , 查P66表3-2知室温下Si的 $N_v=1.1\times10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$ . 根据P71式3-52的变体, 可得浓度上限

$$N_{A,\text{max}} = \frac{D_{-}N_{v}}{g_{A}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{A}}{k_{B}T}\right)$$

$$= \frac{0.1 \times 1.1 \times 10^{19}}{4} \times \exp\left(-\frac{0.044}{0.0258}\right) \approx 5 \times 10^{16} \,(\text{cm}^{-3})$$
(2.1)

因此样品处于强电离区, 多子

$$p \approx N_A \approx 1.5 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$$
 (2.2)

少子

$$n = \frac{n_i^2}{p} \approx 6.94 \times 10^6 \text{cm}^{-3}$$
 (2.3)

- 1 题4.2
- 2 题4.3
- 3 题4.7
- 4 题4.11
- 5 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ③ 补充题



## 补偿掺杂Ge的电导率

- 一长2cm的Ge样品掺有 $10^{22}$ m $^{-3}$ 受主, 其矩形截面的线度分别为1mm和2mm.
  - ① 试求室温时的电导率和电阻;
  - ❷ 再掺入5×10<sup>22</sup>m<sup>-3</sup>施主后, 求室温时样品的电导率和电阻.

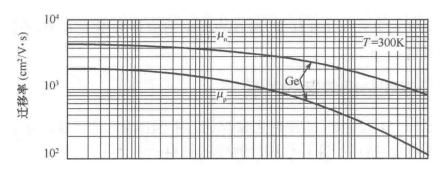


图: P107图4-14(b)-Ge

#### 补偿掺杂Ge的电导率

类似式2.1计算得到, 室温下杂质(假设施主为P, 受主为B)全部电离的浓度上限

$$\begin{cases} N_{D,\text{max}} = \frac{0.1 \times 1.1 \times 10^{19}}{2} \times \exp\left(-\frac{0.012}{0.0258}\right) \approx 3.454 \times 10^{17} \,(\text{cm}^{-3}) \\ N_{A,\text{max}} = \frac{0.1 \times 3.9 \times 10^{18}}{4} \times \exp\left(-\frac{0.01}{0.0258}\right) \approx 6.617 \times 10^{16} \,(\text{cm}^{-3}) \end{cases}$$
(3.1)

因此题中掺入施主前后均可视为完全电离.



# 补偿掺杂Ge的电导率(1)(2)

查P107图4-14(b)-Ge知,  $N=N_A+N_D=10^{16}{
m cm}^{-3}$ 时, 多子空穴迁移率 $\mu_p\approx 1500{
m cm}^2/({
m V\cdot s})$ . 电导率

$$\sigma_1 = N_A e \mu_p \approx 2.4 \text{S/cm}$$
 (3.2)

电阻

$$R_1 = \frac{l}{\sigma_1 S} \approx 41.67\Omega \tag{3.3}$$

同理,  $N=N_A+N_D=6\times 10^{16}{\rm cm}^{-3}$ 时, 多子电子迁移率 $\mu_n\approx 3200{\rm cm}^2/({\rm V\cdot s})$ . 电导率

$$\sigma_2 = (N_D - N_A) e \mu_n \approx 20.48 \text{S/cm}$$
 (3.4)

电阻

$$R_2 = \frac{l}{\sigma_2 S} \approx 4.88\Omega \tag{3.5}$$

- 1 题4.2
- 2 题4.3
- ③ 题4.7
- 4.11
- 5 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ③ 补充题



王民泽

## 掺杂Si在电场中的性质

一截面积为 $10^{-3}$ cm $^2$ 的p-type Si样品掺有 $10^{13}$ cm $^{-3}$ 受主, 其内部加有 $10^3$ V/cm电场. 试求如下情况时样品的电导率及流过的电流密度和电流:

- 室温时;
- **2** 400K时.

# 掺杂Si在电场中的性质(1)

根据题4.3结论, 室温下该掺杂浓度的p-Si处于强电离区. 查P107表4-1知此时 $\mu_p=500{
m cm}^2/({
m V}\cdot{
m s})$ , 故电导率

$$\sigma_1 = 10^{13} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 500 = 8 \times 10^{-4} (\text{S/cm})$$
 (4.1)

电流密度及电流

$$j_1 = \sigma_1 E = 0.8 \text{A/cm}^2$$
  
 $I_1 = j_1 S = 8 \times 10^{-4} \text{A}$  (4.2)



# 掺杂Si在电场中的性质(2)

忽略禁带宽度随温度的变化,可计算400K时的本征载流子浓度

$$n_i' = n_i \left(\frac{T'}{T}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{E_g}{2k_B} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'}\right)\right] \approx 3.43 \times 10^{12} \left(\text{cm}^{-3}\right) > 0.1 N_A$$
(4.3)

因而样品已处于过渡区. 根据式3-74, 多子空穴

$$p = \frac{N_A}{2} \left[ 1 + \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2} \right)^{1/2} \right]$$

$$= \frac{10^{13}}{2} \left[ 1 + \left( 1 + \frac{4 \times 3.43^2 \times 10^{24}}{10^{26}} \right)^{1/2} \right] \approx 1.1 \times 10^{13} \, (\text{cm}^{-3})$$
(4.4)

少子电子

$$n = \frac{n_i^2}{p} \approx 1.063 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$$
 (4.5)

◆□▶◆圖▶◆臺▶◆臺▶○臺

# 掺杂Si在电场中的性质(2)

设已知
$$\mu_n = 700 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s}), \ \mu_p = 220 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s}), \ \text{可得电导率}$$

$$\sigma_2 = ne\mu_n + pe\mu_n \approx 5.063 \times 10^{-4} \text{S/cm} \tag{4.6}$$

并有

$$j_2 = \sigma_2 E \approx 0.506 \text{A/cm}^2$$
  
 $I_2 = j_2 S \approx 5.063 \times 10^{-4} \text{A}$  (4.7)



- 1 题4.2
- 2 题4.3
- ③ 题4.7
- 4 题4.11
- ⑤ 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ③ 补充题



王民泽

## 补偿掺杂Si的性质

试计算掺有 $1.1 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ 的B及 $9 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 的P的Si样品, 其在室温下的多子, 少子浓度及电阻率.

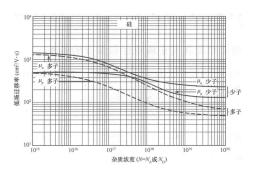


图: P107图4-14(a)

## 补偿掺杂Si的性质

查P107图4-14(a)知,  $N=N_A+N_D=2\times 10^{16}{
m cm}^{-3}$ 时, 多子空穴迁移率 $\mu_p\approx 360{
m cm}^2/({
m V\cdot s}).$ 

根据题4.3结论知样品处于强电离区,故多子

$$p = N_A - N_D = 2 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$
 (5.1)

少子

$$n = \frac{n_i^2}{p} \approx 5.202 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$$
 (5.2)

电阻率

$$\rho = \frac{1}{pe\mu_p} \approx 8.68\Omega \cdot \text{cm} \tag{5.3}$$

注: 本题不可直接查P109图4-15(b), 因为根据4.4.1节开头所述该曲线仅适用于非补偿或轻补偿的材料.

- 1 题4.2
- 2 题4.3
- ③ 题4.7
- 4 题4.11
- 5 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ③ 补充题



## 不同施主浓度的Ge与GaAs样品

有施主浓度分别为 $10^{14}$ cm $^{-3}$ 和 $10^{17}$ cm $^{-3}$ 的两Ge样品, 设杂质全部电离:

- ① 分别计算室温时的电导率;
- ② 若为两GaAs样品, 重复(1)的计算.

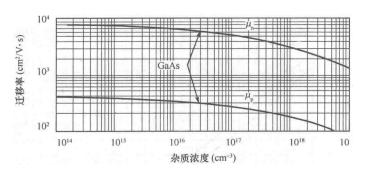


图: P107图4-14(b)-GaAs

#### 不同施主浓度的Ge样品

查P66表3-2知室温下Ge的 $n_i=2.33\times 10^{13}{\rm cm}^{-3}$ ,对 $N_{D1}=10^{14}{\rm cm}^{-3}$ 的样品而言,原则上应认为处于强电离区的边缘. 此时,考虑少子空穴浓度

$$n = \frac{n_i^2}{p} \approx 5.43 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$$
 (6.1)

与否对结果有一定影响, 但影响有限.

查P107图4-14(b)-Ge知,  $N_{D1}$ 和 $N_{D2}=10^{17}{\rm cm}^{-3}$ 时的多子电子迁移率分别为  $\mu_{n1}\approx 4800{\rm cm}^2/({\rm V\cdot s})$ 和 $\mu_{n2}\approx 3000{\rm cm}^2/({\rm V\cdot s})$ . 可得

$$\sigma_1 = N_{D1}e\mu_{n1} \approx 0.077 \text{S/cm}$$
  

$$\sigma_2 = N_{D2}e\mu_{n2} \approx 48 \text{S/cm}$$
(6.2)

#### 不同施主浓度的GaAs样品

查P107图4-14(b)-GaAs知,  $N_{D1}$ 和 $N_{D2}$ 时的多子电子迁移率分别为  $\mu_{n1} \approx 8000 \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V} \cdot \mathrm{s})$ 和 $\mu_{n2} \approx 5200 \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V} \cdot \mathrm{s})$ . 可得

$$\sigma_1 = N_{D1}e\mu_{n1} \approx 0.128 \text{S/cm}$$
 $\sigma_2 = N_{D2}e\mu_{n2} \approx 83.2 \text{S/cm}$ 
(6.3)



- ① 题4.2
- 2 题4.3
- ③ 题4.7
- 4 题4.11
- 5 题4.13
- 7 题4.16
- ③ 补充题



王民泽

## 多种不同补偿掺杂Si的性质

分别计算掺有下列杂质的Si在室温下的载流子浓度, 迁移率和电阻率:

- $3 \times 10^{15} \text{cm}^{-3} \text{B};$
- $21.3 \times 10^{16} \text{cm}^{-3} \text{B} + 10^{16} \text{cm}^{-3} \text{P};$
- $31.3 \times 10^{16} \text{cm}^{-3} \text{P} + 10^{16} \text{cm}^{-3} \text{B};$
- $3 \times 10^{15} \text{cm}^{-3} \text{P} + 10^{17} \text{cm}^{-3} \text{Ga} + 10^{17} \text{cm}^{-3} \text{As}.$

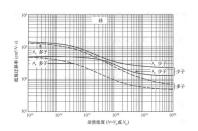


图: P107图4-14(a)



# 多种不同补偿掺杂Si的性质(1)

说明: 本题所查得迁移率数值均来自P107图4-14(a), 且不难证明题述四种情况均处于强电离区.

载流子浓度

$$p = N_A = 3 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = 3.468 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$$
(7.1)

迁移率

$$\mu_p \approx 480 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

$$\mu_n \approx 1500 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$
(7.2)

$$\rho = \frac{1}{pe\mu_p} \approx 4.34\Omega \cdot \text{cm} \tag{7.3}$$



# 多种不同补偿掺杂Si的性质(2)

载流子浓度同(1). 迁移率

$$\mu_p \approx 350 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

$$\mu_n \approx 1100 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$
(7.4)

$$\rho = \frac{1}{pe\mu_p} \approx 5.95\Omega \cdot \text{cm} \tag{7.5}$$

# 多种不同补偿掺杂Si的性质(3)

载流子浓度

$$n = 3 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 3.468 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$$
(7.6)

迁移率

$$\mu_n \approx 950 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

$$\mu_p \approx 500 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$
(7.7)

$$\rho = \frac{1}{ne\mu_n} \approx 2.19\Omega \cdot \text{cm} \tag{7.8}$$

# 多种不同补偿掺杂Si的性质(4)

载流子浓度同(3). 迁移率

$$\mu_n \approx 500 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

$$\mu_p \approx 450 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$
(7.9)

$$\rho = \frac{1}{ne\mu_n} \approx 4.167\Omega \cdot \text{cm} \tag{7.10}$$



- 1 题4.2
- ② 题4.3
- ③ 题4.7
- 4 题4.11
- 5 题4.13
- 6 题4.15
- 7 题4.16
- ⑧ 补充题



## GaAs中的Si掺杂

Si原子加至GaAs中,可取代Ga原子成为施主杂质或取代As原子成为受主杂质.假定Si原子浓度为 $2\times10^{14}cm^{-3}$ ,其中5%取代As原子,95%取代Ga原子,并在室温下全部电离.求样品的:

- ❶ 电导率;
- ② Hall系数.

# GaAs中的Si掺杂(1)(2)

依题

$$N_D = 1.9 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$
  
 $N_A = 10^{13} \text{cm}^{-3}$  (8.1)

故 $n = N_D - N_A = 1.8 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$ . 查P66表3-2知室温 下GaAs的 $n_i = 1.1 \times 10^7 \text{cm}^{-3}$ ,因而 $p \ll n$ 可略.

查P107图4-14(b)-GaAs知

$$\mu_n \approx 8000 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

$$\mu_p \approx 380 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$
(8.2)

得到电导率

$$\sigma = ne\mu_n \approx 0.23 \text{S/cm} \tag{8.3}$$

由于 $p \ll n$ 可略, 故可视为单种载流子的Hall效应. 有

$$R_{\rm H} = -\frac{1}{ne} \approx -3.472 \times 10^4 {\rm cm}^3/{\rm C}$$
 (8.4)

干民泽

32 / 32